

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61347-2-8

2000

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2006-01

Amendement 1

Appareillages de lampes –

**Partie 2-8:
Prescriptions particulières pour les ballasts
pour lampes fluorescentes**
(standards.iteh.ai)

Amendment 1
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc37/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006>
Lamp controlgear –

**Part 2-8:
Particular requirements for ballasts
for fluorescent lamps**

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34C Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34C/708/FDIS	34C/716/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Le contenu du corrigendum d'août 2012 a été pris en considération dans cet exemplaire.

[IEC 61347-2-8:2000/AMD1:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006)

Page 2

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006>

SOMMAIRE

Ajouter le titre du nouvel Article 22:

22 Tension de sortie à vide

Ajouter à la liste des figures le titre de la nouvelle Figure I.1, comme suit :

Figure I.1 – Circuit d'essai pour appareillages magnétiques destinés aux lampes comportant des dispositifs d'amorçage incorporés

Page 12

7.1 Marquages obligatoires

Remplacer, à la page 14, le premier tiret existant par ce qui suit:

- points a), b), e), f), g) et r) du 7.1 de la CEI 61347-1, conjointement avec

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34C/708/FDIS	34C/716/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of August 2012 have been included in this copy.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 61347-2-8:2000/AMD1:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006>

Page 3

CONTENTS

Add the title of the following new clause:

22 No-load output voltage

Add the title of the following new figure:

Figure I.1 – Test circuit for magnetic controlgear, for lamps with internal starting devices

Page 13

7.1 Mandatory markings

Replace, on page 15, the existing first indent with:

– items a), b), e), f), g) and r) of 7.1 of IEC 61347-1, together with

Page 16

14.3 Essai d'échauffement des ballasts

Remplacer le premier alinéa par:

Lorsque le ballast est essayé dans les conditions définies dans l'Annexe H et suivant les informations données dans l'Annexe J, les températures ne doivent pas dépasser les valeurs figurant au Tableau 2 pour les essais en conditions normales et anormales (si applicable).

NOTE Les conditions anormales dans un circuit sont détaillées à l'Annexe D de la CEI 60598-1.

Page 18

Tableau 2 – Températures maximales

Remplacer, dans la 1^{ère} colonne, « Eventuellement, condensateur voisin du boîtier du ballast » par « Boîtier du ballast voisin du condensateur, s'il existe (incorporé dans l'enveloppe du ballast) ».

Supprimer les NOTES 1 et 2 situées au bas du Tableau 2.

Insérer, immédiatement sous le Tableau 2, les deux alinéas suivants.

S'il est fait usage de matériaux ou de procédés de fabrication autres que ceux indiqués dans ce tableau, il ne faut pas les soumettre en fonctionnement à des températures supérieures à celles admissibles pour ces matériaux.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-41d70f9e3c1d/61347-2-8:2006-amd1-2006>

Il ne faut pas que les températures indiquées dans ce tableau soient dépassées lorsque le ballast fonctionne à sa température ambiante maximale déclarée, le cas échéant. Il faut considérer la température ambiante maximale pour un ballast, si elle n'est pas déclarée, comme la différence entre la température t_w marquée et l'élévation de température de l'enroulement mesurée Δt à 100 % de la tension assignée.

Page 22

Paragraphe 15.1

Dans le premier alinéa, ainsi que dans le deuxième et le cinquième alinéa, remplacer "échantillons" par "ballasts".

Dans le premier alinéa, remplacer "essai diélectrique" par "essai de rigidité diélectrique".

Dans le quatrième alinéa, modifier la dernière phrase comme suit:

La mesure des impulsions de tension est effectuée directement aux bornes du ballast, conformément à l'Annexe I et à la Figure I1.

Page 17

14.3 Ballast heating test

Replace the first paragraph with the following:

When the ballast is tested in accordance with the conditions of Annex H and the information given in Annex J, the temperature shall not exceed the appropriate values given in Table 2 for the tests under normal and abnormal conditions, if applicable.

NOTE Abnormal circuit conditions are detailed in Annex D of IEC 60598-1.

Page 19

Table 2 – Maximum temperatures

Replace, in the first column, the item “Capacitor, if any, adjacent to the ballast case” with “Ballast case adjacent to capacitor, if any (incorporated in ballast enclosure)”.

Delete table Notes 1 and 2.

Immediately below Table 2, insert the two following paragraphs.

If materials or manufacturing methods are used other than those indicated in this table, they must not be operated at temperatures higher than those which are proved to be permissible for those materials.

The temperature in this table must not be exceeded when the ballast is operated at its maximum declared ambient temperature, if any. Maximum ambient temperature for a ballast, if not declared, must be considered as the difference between the marked t_w and the measured winding temperature rise Δt at 100% rated voltage.

Page 23

Subclause 15.1

In the first, second and fifth paragraphs, replace “samples” with “ballasts”.

In the first paragraph, replace “dielectric” with “electric”

In the fourth paragraph, change the last sentence as follows:

The measurement of the voltage pulses is made directly at the ballast terminations and in accordance with Annex I and Figure I.1.

Subclause 15.2

In the third paragraph, replace “samples” with “ballasts”.

Page 25

Add the following new clause:

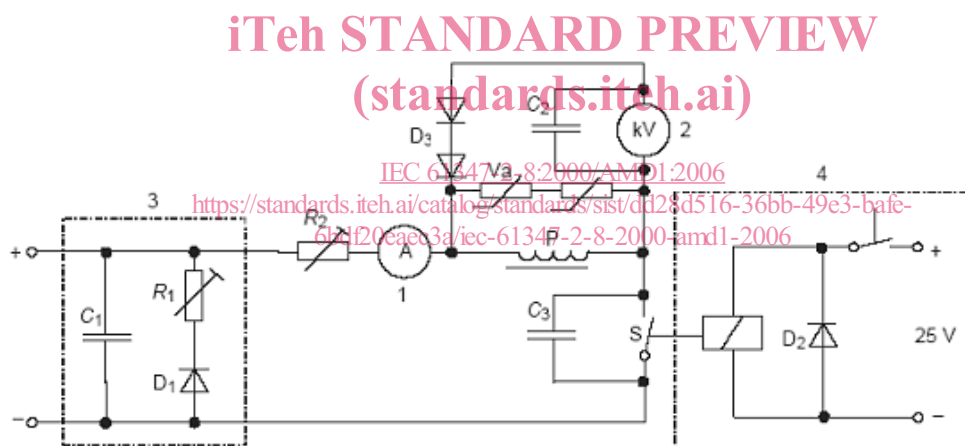
22 No-load output voltage

The requirements of Clause 20 of IEC 61347-1 apply.

Page 31

Annex I – Method for selection of varistors

Add the following new Figure I.1:

**Key**

- 1 Ammeter for measuring the d.c. current
- 2 Electrostatic voltmeter with a self-capacitance not exceeding 30 pF for measuring the pulse voltage
- 3 Protection device for power supply
- 4 Supply for switch control: optional
- $C_1 = 0,66 \mu\text{F}$
- $C_2 = 5\,000 \text{ pF}$
- $C_3 = 50 \text{ pF}$
- $D_1 =$ Diode ZD22
- $D_2 =$ Diode IN4004
- $D_3 =$ Diode (6 pieces) BYV96E
- P Test sample
- R_1 Adjustable resistor (approximately 100Ω)
- R_2 Adjustable resistor: $R_2 \geq \text{Ballast} \times 20$
- S Vacuum switch
- Va Varistors (for selection see Annex I)

Figure I.1 – Test circuit for magnetic controlgear, for lamps with integral starting devices

Page 34

Annexe J

J.3 Disposition pour les essais

La modification ne concerne que la version anglaise.

Après l'Annexe J, introduire la nouvelle Annexe K ci-dessous.

Annexe K (normative)

Exigences complémentaires pour les ballasts magnétiques à incorporer avec isolation double ou renforcée

Les exigences de l'Annexe I de la CEI 61347-1 s'appliquent.

ITeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 61347-2-8:2000/AMD1:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006>

Page 35

Annex J – Explanation of ballast temperatures

J.3 Test arrangement

In the second and third paragraphs, replace “Lamp controlgear” by “Ballast”.

Introduce, after Annex J, the following new annex:

Annex K (normative)

Additional requirements for built-in magnetic ballasts with double or reinforced insulation

The requirements of Annex I of IEC 61347-1 apply.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 61347-2-8:2000/AMD1:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dd28d516-36bb-49e3-bafe-6bdf20eacc3a/iec-61347-2-8-2000-amd1-2006>